



**Ministero**  
**per i Beni e le Attività Culturali**  
*Direzione generale per l'Organizzazione,*  
*l'Innovazione, la Formazione, la Qualificazione*  
*professionale e le Relazioni sindacali*  
**Servizio II**

Circolare n. **185**

Roma, 21/08/2008

---

Ai Direttori degli Uffici e Istituti  
centrali e periferici

---

LORO SEDI

---

Prot. N. **22998**  
Class. 16.34.13/2

Allegati N° 1

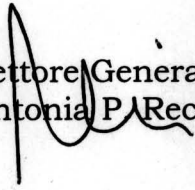
Risposta al foglio del  
N°

**Oggetto:** Corso teorico-pratico di Microscopia Elettronica a Scansione applicata ai Beni Culturali a Roma in data 8 -10 ottobre 2008.

Si trasmette per opportuna conoscenza e massima diffusione l'iniziativa organizzata dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (Ex Istituto Centrale per il Restauro) e dalla Società Italiana Scienze Microscopiche relativa al seminario indicato in oggetto di cui si allega il programma.

Nella documentazione allegata sono indicate le condizioni di partecipazione a cui ogni interessato dovrà attenersi.

Il Direttore Generale  
(Arch. Antonia P. Recchia)



II bott. Paparella  
M

**DG-OIF**

**Da:** "Barbara Davidde" <bdauidde.icr@beniculturali.it>  
**A:** <cfr@beniculturali.it>; <dg-agbruf@beniculturali.it>; <dg-a@beniculturali.it>; <dg-ba@beniculturali.it>; <dg-bap@beniculturali.it>; <dg-bl@beniculturali.it>; <dg-c@beniculturali.it>; <dg-psae@beniculturali.it>; <dg-aac@beniculturali.it>; <dg-itp@beniculturali.it>; <dg-s@beniculturali.it>; <dr-fvg@beniculturali.it>; <dr-laz@beniculturali.it>; <dr-mol@beniculturali.it>; <dr-pie@beniculturali.it>; <dr-ven@beniculturali.it>; <dr-bas@beniculturali.it>; <dr-cal@beniculturali.it>; <dr-cam@beniculturali.it>; <dr-lig@beniculturali.it>; <dr-lom@beniculturali.it>; <dr-pug@beniculturali.it>; <dr-sar@beniculturali.it>; <dr-tos@beniculturali.it>; <dr-abr@beniculturali.it>; <dr-mar@beniculturali.it>; <dr-ero@beniculturali.it>; <dr-umb@beniculturali.it>  
**Data invio:** lunedì 28 luglio 2008 10.24  
**Allega:** SISM Roma ottobre 2008.pdf  
**Oggetto:** Corso teorico-pratico di Microscopia Elettronica a Scansione applicata ai Beni Culturali.

L'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro e la Società Italiana Scienze Microscopiche, in data 8-10 Ottobre 2008, organizzano il **Corso teorico-pratico di Microscopia Elettronica a Scansione applicata ai Beni Culturali**.  
Il corso è rivolto a ricercatori, studenti e tecnici interessati alla microscopia elettronica ed in generale a chi opera nel campo dei Beni Culturali.

Si allega la brochure del corso, con preghiera di darne diffusione.

Barbara Davidde

Dr.ssa Barbara Davidde  
Sezione promozione e comunicazione

Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro  
(Ex Istituto Centrale per il Restauro)  
Piazza San Francesco di Paola, 9 00184 ROMA  
tel. 06-48896416/426  
fax 06-4815704

## Programma

**Mercoledì 8 Ottobre 2008**

10:30 Registrazione

10:50 Saluto ai partecipanti

11:00 SEM: Struttura e funzionamento

(M. Vittori Antisari, CR ENEA Casaccia, Roma)

12:00 SEM: Tipi di segnali

(V. Morandi, IMM-CNR, Bologna)

13:00 Pausa pranzo

15:00 SEM: Imaging

(V. Morandi, IMM-CNR, Bologna)

16:00 Microanalisi a Raggi X

(M. Vittori Antisari, CR ENEA Casaccia, Roma)

17:00 SEM e microanalisi a Raggi X applicati ai

materiali vitrei

(M. Verità, SSV, Murano (VE))

**Giovedì 9 Ottobre 2008**

9:30 Utilizzo del SEM per lo studio di manufatti metallici antichi con finalità conoscitive e conservative

(G. Ingo, ISMN-CNR, Montelibretti (RM))

10:30 Coffe break

11:00 Applicazioni SEM-EDS per lo studio dei dipinti su muro, su tavola e su tela

(F. Talarico, ISCR, Roma)

12:00 Nanotecnologie per la conservazione del materiale lapideo.

(M. Favaro, P.A. Vigato, ICIS-CNR, Padova)

13:00 Pausa Pranzo

15:00 Novità strumentali:

Imaging ad Ultra Alta Risoluzione per campioni non conduttivi (G.Lamedica, Assing)

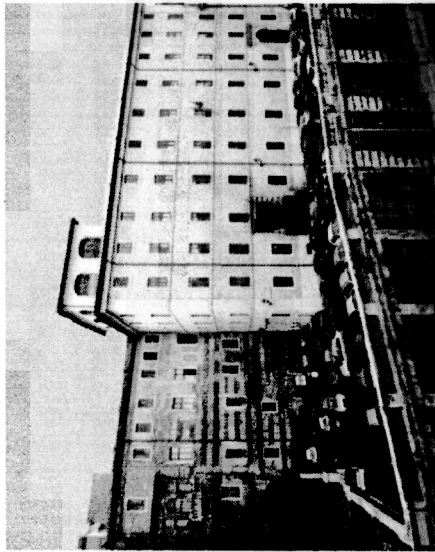
**Venerdì 10 Ottobre 2008**

9:00 Esercitazioni pratiche

(F. Pierdominici, A. Montone, A. Aurora, D. Mirabile Gattia, (CR Casaccia-ENEA))

(G. Sidoti, G. Guida, M. Bartolini, (ISCR))

17:00 Conclusione dei lavori



### Comitato scientifico:

**Amelia Montone**  
(CR ENEA Casaccia)

**Marco Bartolini**  
(ISCR)

**Giuseppe Guida**  
(ISCR)

**Giancarlo Sidoti**  
(ISCR)

### Comitato organizzatore:

**Annalisa Aurora**  
(CR ENEA Casaccia)

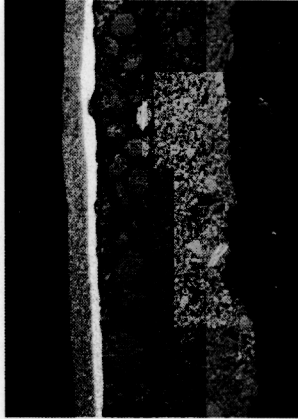
**Barbara Davidde**  
(ISCR)

### Con il supporto di:

**ASSING Spa**

**FEI Company Srl**

**JEOL Italia Spa**



## Corso teorico-pratico di Microscopia Elettronica a Scansione applicata ai Beni Culturali

Roma, 8-10 Ottobre 2008

Istituto Superiore per la  
Conservazione ed il Restauro  
(ex Istituto Centrale per il Restauro)

Piazza S. Francesco di Paola, 9 - Roma

### Informazioni Generali

Il corso, organizzato dalla SISIM in collaborazione con l'ISCR nella suggestiva cornice del Centro Storico di Roma, avrà la durata di tre giorni e sarà incentrato sui principi della Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) e le sue applicazioni nel campo della conservazione e restauro del Patrimonio Artistico.

Il corso è rivolto sia a ricercatori, studenti e tecnici interessati alla microscopia elettronica, sia a chi opera in generale nel campo dei beni culturali. La prima parte del corso prevede una sezione teorica, nell'ambito della quale saranno illustrati i principi generali di funzionamento del SEM (descrizione dello strumento, interazione elettrone-materia, microanalisi, ecc.) e mostrate le applicazioni nel campo dei beni culturali. Verranno affrontati argomenti come la caratterizzazione dei materiali costitutivi, le metodologie di indagine per risalire alle tecniche di esecuzione e per la valutazione dello stato di conservazione dei manufatti storici artistici. Saranno inoltre illustrate alcune applicazioni della microscopia in campi innovativi come le nanotecnologie per la conservazione dei beni culturali.

La parte pratica del corso sarà invece condotta sul microscopio elettronico e consentirà di conoscere le potenzialità della tecnica attraverso alcune dimostrazioni pratiche di analisi di reperti originali. Sempre nell'ambito del corso, le principali ditte leader nel settore della microscopia elettronica presenteranno le ultime novità strumentali e materiali del settore.

E' previsto un test di valutazione finale per gli studenti interessati a richiedere il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU).

È previsto un numero massimo di 30 partecipanti.  
È richiesto un numero minimo di 10 partecipanti per attivare il corso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

dr.<sup>ssa</sup> Amelia Montone ([montone@casaccia.enea.it](mailto:montone@casaccia.enea.it))

### Iscrizione

La scheda di iscrizione deve essere inviata entro il 20 settembre 2008 con una delle seguenti modalità:

- online dal sito [www.sism.it](http://www.sism.it)
- e-mail a [montone@casaccia.enea.it](mailto:montone@casaccia.enea.it)
- fax 06 30483176

unitamente a copia del versamento della quota.

Il costo complessivo del corso è:

**SOCIO SISIM: € 300<sup>1</sup> + IVA 20%<sup>2</sup>**

**NON SOCIO SISIM:<sup>3</sup> € 350<sup>1</sup> + IVA 20%<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Per i *non strutturati* è prevista una riduzione del 20% da calcolarsi sull'importo al netto di IVA delle quote di iscrizione.

<sup>2</sup> I dipendenti di Enti Pubblici sono esentati dal pagamento dell'IVA gravante sulla quota di iscrizione ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72.

<sup>3</sup> Chi farà richiesta di associazione alla SISIM sarà esonerato dal versamento della quota associativa 2009.

Le quote di iscrizione comprendono l'accesso ai lavori, il materiale didattico ed i coffee break; non comprendono i pasti.

A fronte del pagamento sarà rilasciata regolare fattura.

Le quote d'iscrizione possono essere versate attraverso:

- Carta di credito (dal sito [www.sism.it](http://www.sism.it))

- Bonifico bancario intestato a

S.I.S.M.

IBAN: IT 44V0 1005 3888 0000 0000 23074  
presso BNL-Anguilara S.

Causale: "Corso Roma 2008 + Nome del partecipante"

### Scheda di partecipazione Corso Roma Ottobre 2008

Cognome: .....

Nome: .....

Qualifica: .....

Indirizzo: .....

.....

.....

Tel: ..... Fax: .....

E-mail: .....

Socio SISIM  Non socio SISIM   
Strutturato  Non Strutturato

### DATI PER FATTURAZIONE

(per le fatture emesse a persona fisica è necessario fornire indirizzo di residenza e codice fiscale.

per i dipendenti di Enti Pubblici, al fine di usufruire dell'esenzione iva, è necessario fornire i dati dell'università e/o dipartimento di appartenenza)

### INTESTAZIONE

(Ente, Università, Dipartimento o Persona fisica)

INDIRIZZO: .....

PARTITA IVA / C.F. ....